

Introdução

Sistema de Microscopia de Força Atômica AFM (Atomic Force Microscopy)

Projeto 2020/12980-3 concedido pela FAPESP.

Responsável

Prof^a. Dr^a. Marisa Masumi Beppu

Localização

LRAC - LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMASSA, RECURSOS ANALÍTICOS E DE CALIBRAÇÃO na Faculdade de Engenharia Química.

Descrição

O equipamento Sistema de Microscopia de Força Atômica AFM (Atomic Force Microscopy), fabricado pela : Nanosurf AG, (Liestal, Switzerland), é um equipamento multiusuário (EMU) e as análises por AFM são utilizadas para caracterização de superfície de amostras variadas, tais como semicondutores, polímeros, cerâmicos, materiais orgânicos e inorgânicos. Por meio desta técnica podem-se obter informações sobre a topografia, perfis de profundidade da amostra e morfologia de superfícies.

As regras de uso do equipamento estão descritas no plano de gestão abaixo:

[- Plano para gestão e uso do equipamento](#)

Foto:

